

ALL3 VERB 3

TRACCIA ESTRATTA



**AMBITO 01 "Misure dimensionali per la metrologia delle superfici e sviluppo di sensori, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca nel campo della sensoristica e alla disseminazione del metro"**

### **Traccia n. 1**

Sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze professionali, il candidato descriva una tecnica di misurazione utilizzata nell'ambito della metrologia dimensionale, con particolare riferimento alla realizzazione di campioni per la metrologia delle superfici.

AU 3 VERB 3

TRACCIA NON ESTATA

**AMBITO 01 "Misure dimensionali per la metrologia delle superfici e sviluppo di sensori, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca nel campo della sensoristica e alla disseminazione del metro"**



**Traccia n. 2**

Sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze professionali, nell'ambito della metrologia dimensionale e della caratterizzazione metrologica delle superfici, il candidato illustri i concetti di riferibilità e disseminazione, e fornisca un esempio di bilancio di incertezza associato alla misurazione descritta.

ALL 3 VERB 3

TRACCA NON ESTRATTA

**AMBITO 01 "Misure dimensionali per la metrologia delle superfici e sviluppo di sensori, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca nel campo della sensoristica e alla disseminazione del metro"**



### **Traccia n 3**

Sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze professionali, il candidato descriva una metodologia di misurazione dimensionale a livello di nano-scala, in particolare in relazione alla metrologia delle superfici. Si descrivano brevemente le strumentazioni e le tecniche di misurazione utilizzate su questa scala, e si indichino le problematiche associate, ad esempio come viene attribuita la riferibilità metrologica.